Энергетический спектр и волновые функции электронов в туннельно-связанных сферических квантовых точках InAs/GaAs

© Г.Ф. Глинский, Д.А. Шапран

08.3

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия E-mail: genaglinskii@mail.ru

Поступило в Редакцию 7 ноября 2019 г. В окончательной редакции 7 ноября 2019 г. Принято к публикации 16 декабря 2019 г.

Представлены результаты численного расчета энергии основного состояния электрона и электронной плотности в туннельно-связанных квантовых точках InAs/GaAs, образующих простую кубическую сверхрешетку. Расчет проводится в рамках модифицированного метода эффективной массы, учитывающего микроскопическое (атомарное) строение отдельных квантовых точек, без учета спин-орбитального взаимодействия и деформационных эффектов. Исследована зависимость энергии связи электрона от радиуса квантовых точек R. Показано, что в области R < 27 Å энергия связи электрона пропорциональна R^3 .

Ключевые слова: квантовые точки, сверхрешетки, электронная плотность.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.06.49159.18104

Расчет энергетического спектра и волновых функций носителей заряда в квантовых точках (КТ) относится к числу важнейших задач современной наноэлектроники. В настоящее время можно выделить два основных подхода к решению этой задачи. В основе первого из них лежат методы, приближающиеся к ab initio: это метод функционала плотности (DFT) [1] и метод псевдопотенциала [2-6]. Для реализации обоих методов требуются значительные вычислительные ресурсы. Второй подход основан на использовании традиционного метода эффективной массы в его континуальном приближении [7-10]. Однако неоднозначность определения эффективного *kp*-гамильтониана гетероструктуры (ГС), а также граничных условий для огибающих волновых функций не позволяет использовать его для расчета КТ малых размеров и сверхрешеток (СР) на их основе.

В работах [11-13] в рамках метода эффективной массы предложен новый подход к определению энергетического спектра и волновых функций носителей заряда в полупроводниковых ГС, таких как квантовые ямы, проволоки, КТ и СР. В основе этого подхода лежит введение характеристической функции $f(\mathbf{a})$, указывающей на замещение в элементарной ячейке с номером а атомов опорного кристалла атомами другого материала. В отличие от обычно используемого континуального приближения данный метод позволяет учесть микроскопическое строение ГС, а значит, ее реальную симметрию, включая симметрию интерфейсов. Было показано, что он может быть реализован в двух унитарно эквивалентных k- и a-представлениях. Для одиночных ГС конечных размеров и СР определение энергетического спектра и волновых функций носителей заряда в обоих представлениях сводится к поиску собственных чисел и собственных столбцов эффективного матричного гамильтониана. В k-представлении такой гамильтониан

можно определить, используя kp-теорию возмущений или метод инвариантов [11,12]. Это позволяет корректным образом учесть в эффективном гамильтониане ГС интерфейсные поправки, обусловленные изменением зонных параметров материалов на гетерогранице, а также поправки, связанные с наличием короткодействующей части интерфейсного потенциала.

В настоящей работе данный подход используется для расчета энергетического спектра и огибающих волновых функций электронов в туннельно-связанных сферических КТ InAs/GaAs, образующих простую кубическую 3D СР. Исследуется зависимость энергии основного состояния электрона в центре зоны Бриллюэна СР $(\mathbf{K} = 0)$ от радиуса КТ $R \ (R \approx 7-27 \text{ Å})$. Расчет проводится в рамках однозонной Г₁-модели без учета деформационных эффектов и спин-орбитального взаимодействия. Примитивные векторы трансляции прямой **D**_{1,2,3} и обратной G_{1,2,3} СР определяются соответственно как $\mathbf{D}_1 = D_0(1, 0, 0), \, \mathbf{D}_2 = D_0(0, 1, 0), \, \mathbf{D}_3 = D_0(0, 0, 1)$ и $\mathbf{G}_1 = G_0(1, 0, 0), \ \mathbf{G}_2 = G_0(0, 1, 0), \ \mathbf{G}_3 = G_0(0, 0, 1),$ где $D_0 = pa_0, G_0 = 2\pi/D_0, a_0$ — постоянная решетки InAs, p = 13. В соответствии с этим объем сверхъячейки $\Omega_s = N\Omega_0$, где $N = 4p^3$ — число элементарных ячеек кристалла в сверхъячейке (N = 8788), $\Omega_0 = a_0^3/4$ объем элементарной ячейки.

Согласно [13], уравнение Шредингера для электрона в СР в **k**-представлении для простой невырожденной зоны имеет вид

$$\sum_{j} H(\mathbf{k}_{i}, \mathbf{k}_{j}; \mathbf{K}) F(\mathbf{k}_{j}; \mathbf{K}) = E(\mathbf{K}) F(\mathbf{k}_{i}; \mathbf{K}).$$
(1)

Здесь $H(\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_j; \mathbf{K})$ — эффективный матричный *kp*-гамильтониан, параметрически зависящий от волнового вектора электрона в зоне Бриллюэна СР **K**; $F(\mathbf{k}_j; \mathbf{K})$ — огибающая волновая функция



Рис. 1. Зависимость энергии основного состояния электрона $(\mathbf{K} = 0)$ от радиуса сферических КТ. Разрыв зоны проводимости $\Delta E = 0.55 \,\text{eV}$. Энергия отсчитывается от дна зоны проводимости GaAs.

электрона в **k**-представлении; $\mathbf{k}_{i,j}$ — волновые векторы, пробегающие дискретный ряд значений (i, j = 1...N) и равные векторам обратной СР $\mathbf{G} = m_1 \mathbf{G}_1 + m_2 \mathbf{G}_2 + m_3 \mathbf{G}_3$ $(m_{1,2,3} = 0, \pm 1, \pm 2...)$, попадающим в зону Бриллюэна кристалла. Без учета поправок от короткодействующей части интерфейсного потенциала эффективный гамильтониан представим в виде [12]:

$$H(\mathbf{k}_{i}, \mathbf{k}_{j}; \mathbf{K}) = E_{\text{InAs}}^{1^{1}} \delta_{ij} + \Delta E f(\mathbf{k}_{i} + \mathbf{k}_{j})$$
$$+ \frac{\hbar^{2} (\mathbf{k}_{i} + \mathbf{K})^{2}}{2m_{\text{InAs}}^{*}} \delta_{ij} + \frac{\hbar^{2}}{2} \left(\frac{1}{m_{\text{GaAs}}^{*}} - \frac{1}{m_{\text{InAs}}^{*}} \right)$$
$$\times (\mathbf{k}_{i} + \mathbf{K}) \cdot (\mathbf{k}_{i} + \mathbf{K}) f(\mathbf{k}_{i} - \mathbf{k}_{i}).$$
(2)

Здесь в качестве опорного кристалла выбран InAs, $E_{\text{InAs}}^{\Gamma_1}$ — энергия, определяющая положение дна зоны проводимости InAs, $\Delta E = E_{\text{GaAs}}^{\Gamma_1} - E_{\text{InAs}}^{\Gamma_1}$ — разрыв зоны Γ_1 в ГС, m_{InAs}^* и m_{GaAs}^* — эффективные массы электронов в зоне Γ_1 в InAs и GaAs соответственно,

$$f(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j) = \frac{1}{N} \sum_{l} f(\mathbf{a}_l) e^{-i(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j)\mathbf{a}_l}$$
(3)

— фурье-образ характеристической функции $f(\mathbf{a}_l)$, которая принимает значение 1, если в элементарной ячейке с номером \mathbf{a}_l происходит замещение атомов InAs атомами GaAs, и 0, если такого замещения нет. Суммирование в (3) производится по всем векторам прямой решетки \mathbf{a}_l (узлам решетки Браве), попадающим в сверхъячейку СР ($l = 1 \dots N$). Последнее слагаемое в правой части (2) следует рассматривать как поправку к методу эффективной массы, учитывающую изменение эффективной массы электрона при переходе через интерфейс. В континуальном приближении эта поправка

приводит к разрыву на интерфейсах первых производных от огибающих волновых функций.

Таким образом, в рассматриваемом нами подходе определение энергетического спектра электрона и его огибающих волновых функций в **k**-представлении сводится к поиску параметрически зависящих от **K** собственных чисел и собственных столбцов матричного гамильтониана (2), размерность которого $N \times N$. Переход к огибающим волновым функциям в **a**-представлении $F(\mathbf{a}_l; \mathbf{K})$ осуществляется посредством обратного фурье-преобразования

$$F(\mathbf{a}_{i};\mathbf{K}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i} F(\mathbf{k}_{i};\mathbf{K}) e^{i\mathbf{k}_{i}\mathbf{a}_{i}}, \qquad (4)$$

где экспоненциальные функции $(1/\sqrt{N})e^{i\mathbf{k}_i\mathbf{a}_l}$ удовлетворяют следующим условиям ортонормированности и полноты:

$$\frac{1}{N}\sum_{l}e^{-i(\mathbf{k}_{l}-\mathbf{k}_{j})\mathbf{a}_{l}} = \delta_{ij},$$
$$\frac{1}{N}\sum_{l}e^{i\mathbf{k}_{l}(\mathbf{a}_{l}-\mathbf{a}_{j})} = \delta_{ij}.$$

Огибающая волновая функция в **х**-представлении определяется следующим соотношением [13]:

$$F(\mathbf{x}; \mathbf{K}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i} F(\mathbf{k}_{i}; \mathbf{K}) e^{i\mathbf{k}_{i}\mathbf{x}}.$$
 (5)

Поскольку область, в которой определены N векторов \mathbf{k}_i , ограничена зоной Бриллюэна кристалла, это соотношение в отличие от (4) не является обратным преобразованием Фурье.

На рис. 1 и 2 представлены зависимость энергии основного состояния электрона в СР в центре зоны Бриллюэна ($\mathbf{K} = 0$) от радиуса квантовой точки R и распределение электронной плотности $|F(\mathbf{x}; 0)|^2$ в



Рис. 2. Распределение электронной плотности, соответствующее основному состоянию электрона ($\mathbf{K} = 0$) в СР.

кристаллографической плоскости (001). Как следует из рис. 1, энергия связи электрона в области R < 27 Å пропорциональна R^3 .

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственное задание № 16.1750.2017/4.6).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Hammerschmidt T, Kratzer P, Scheffler M. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. P. 235303 (1–16). DOI: 10.1103/PhysRevB.77.235303
- [2] Wang L.W., Kim J., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59.
 P. 5678–5687.
- [3] Wang L.W., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. P. 15806– 15818.
- [4] Williamson A.J., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1999. V. 59.
 P. 15819–15824.
- [5] Williamson A.J., Wang L.W., Zunger A. // Phys. Rev. B. 2000.
 V. 62. P. 12963–12977.
- [6] Luo J.W., Bester G., Zunger A. // Phys. Rev. B. 2009. V. 79.
 P. 125329 (1–15). DOI: 10.1103/PhysRevB.79125329
- [7] Wang L.W., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. P. 11417– 11435.
- [8] Fu H., Wang L.W., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1998. V. 57.
 P. 9971–9987.
- [9] Stier O., Grundmann M., Bimberg D. // Phys. Rev. B. 1999.
 V. 59. P. 5688–5701.
- [10] Moskalenko A.S., Berakdar J., Prokofiev A.A., Yassievich I.N. // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. P. 085427 (1–9). DOI: 10.1103/PhysRevB.76.085427
- [11] Глинский Г.Ф. Полупроводники и полупроводниковые наноструктуры: симметрия и электронные состояния. СПб.: Технолит, 2008. 324 с. http://www.twirpx.com/file/1014651/
- [12] Глинский Г.Ф., Миронова М.С. // ФТП. 2014. Т. 48. В. 10. С. 1359–1369.
- [13] *Глинский Г.Ф. //* Письма в ЖТФ. 2018. Т. 44. В. 6. С. 17–24. DOI: 10.21883/PJTF.2018.06.45763.17113